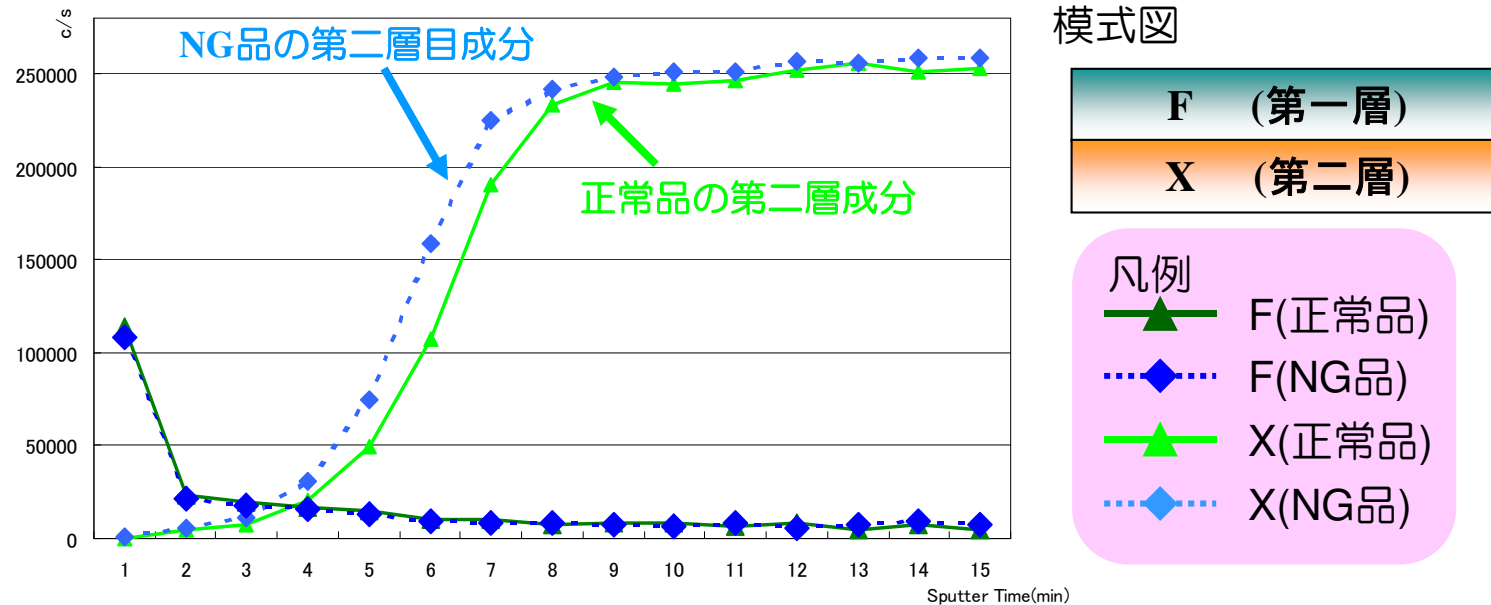


分析事例：表層(第一層)の厚み観察

表層にフッ素を含むコーティングした製品で問題が発生し、正常品とNG品の第一層の厚みを観察しました。(表層に続く第二層には、特徴的な元素Xが存在しています)



(ビーム径 100um、イオン銃 sputter rate 10.16nm/min [SiO₂換算])

以上の結果から、NG品は正常品に比べてSiO₂換算で約10nm第一層の厚みが薄いということが分かりました。

巴川分析センターは分析力でモノづくりを支援します。まずはお気軽にお電話ください。TEL:054-256-4163
 FAX:054-256-4214 URL:<https://bunseki.tomoegawa.co.jp> E-mail:bunseki@tomoegawa.co.jp